

BI4201-LD

LD 老化系统

Version 1.1





产品描述

联讯仪器BI4201-LD LD TO老化系统能够提供高温条件下LD激光器带电老化系统。提供高达200mA的老化电流范围，且老化电流精度为满量程的千分之五，为业界最高老化电流精度。老化温度支持到150°C，支持老化过程中的电流的回馈监控，电压监控，背光监控，阈值扫描，老化板温度监控，驱动板进板电压监控，驱动板温度监控等多种参数的监控和保存，确保老化过程中对产品的监控指标完整。内置UPS电源，高规格的电路设计，确保老化过程中对产品的安全防护。系统配置21.5寸显示器，老化数据显示直观，操作方便，用户体验感佳，软件配置灵活，设置简单。系统广泛用于LD TO的生产老化环节以及产品可靠性部门。

产品特点及优势

- 双温区：每个温区可以独立老化不同产品；
- 大容量：每个温区支持1536颗TO的老化，共支持3072颗TO的老化；
- 软件切换引脚定义：针对目前行业内不同的引脚封装通过软件切换实现；
- 兼容性强：小电流VCSEL TO的老化和大电流FP/DFB TO的老化；
- TO56的SOCKE不张开管座引脚，不损伤管座引脚；
- 提供配套的TO38、TO46、TO56老化板，以及独有的25G双弹片老化板；
- 监控参数完整：包括监控老化电流，正向电压，背光电流；
- 支持通过背光扫描LIV曲线和阈值计算；
- 图形化显示不同监控参数值，包括温度、老化电流、正向电压、背光电流；
- 支持软件定制开发连接客户MES系统和数据库；
- 支持开门报警，开门断电等防呆功能；
- 内置UPS电源，有效保护老化过程中异常数据的丢失；
- 满足EOS、ESD防护以及EHS要求；
- 软件支持权限和账户管理；

软件界面

联讯仪器的BI4201测试软件平台为可配置性平台，用户界面简约直观。



老化软件界面



LD 器件 LIV 扫描



技术指标

系统功能	外形尺寸 (mm)	1520L*1000W*1825H
	支持夹具类型	标准8X8夹具
	系统支持TO数量	3072个
	系统温区	独立两个温区
	LD TO老化	LD老化, MPD监测, LIV扫描
	软件功能	支持测试条件, 测试算法, 测试流程, 测试结果判断标准编辑; 支持权限管控。 支持金样测试监控。支持机台名称监控。
	管脚切换	支持不同器件软件管脚定义切换
	MES系统接口	支持定制开发对接客户的MES系统和数据库
	数据保存	测试原始数据、计算结果、系统运行详细日志的保存
	系统供电	380V, 10KW (满载)
温度控制	温度范围	常温到150°C
	温度升温速度	3°C/分钟 (空载) 1.5°C/分钟 (满载)
	温度控制精度	0.1°C
	温度准确性	±1°C
	温度均匀性 (空间9点产品位置)	±1.5°C 满载 (≤100°C) ±2°C 满载 (≤120°C) ±3°C 满载 (≤150°C)
LD TO老化	驱动板类型	每个通道独立操作和控制
	驱动电流范围	0-20mA and 0-200mA两个挡位
	驱动电流精度	200mA: 0.5% FS, 20mA: 0.5% FS,
	驱动电流稳定性	≤±1%FS
	LD电压范围	0-5.0V
	LD电压精度	0.3%满量程±20mV
	MPD偏置电压范围	0-5V
	MPD偏置电压精度	0.3%FS±100mV
	MPD电流范围	1挡位: 0- 500uA 2挡位: 0-1000uA 3挡位: 0-2500uA
	MPD电流精度	±0.3% FS
安全保护	LIV扫描	支持在老化过程中通过MPD扫描LIV计算Ith等参数
	正常操作下电	≤5mA (电源示波器需要单独供电, 排除供电网络干扰)
	正常操作上电	≤5mA (电源示波器需要单独供电, 排除供电网络干扰)
	市电掉电	≤5mA (电源示波器需要单独供电, 排除供电网络干扰)
	市电上电	≤5mA (电源示波器需要单独供电, 排除供电网络干扰)
	ESD	使用防ESD材料 表面电阻: $1 \times 10^5 \Omega < X < 1 \times 10^9 \Omega$; 摩擦电压: < 100V; Grounding; 系统中所有孤立导体必须接地处理, 所有仪表必须接地处理, 机架必须接地



		处理, 接地电阻 <math>< 4\Omega</math> 鼠标键盘需要防ESD处理
	安全	设备没有尖锐棱角, 没有漏电风险
	清洁	系统没有掉屑, 掉漆和生锈现象

采购信息

BI4201	TO老化系统
类型选件	
LD	标准支持3072路的LD TO老化系统
APD/PIN	标准支持3072路的APD/APD-TIA/PIN/PIN-TIA TO老化系统
老化板选件	
BIN-64TO4P200	TO56 4PIN老化板
BIN-64TO5P200	TO46 5PIN老化板
BIN-COC32-LD	CoC封装老化板



联系我们

销售

销售中心负责人	186-6029-8596 杨建
光芯片老化测试	189-7147-3511 张纪
光通讯测试仪器	186-2613-2729 邓寒
高精度精密源表	185-2212-4627 张盼盼
半导体测试设备	186-6230-5688 梁仕帮

邮箱

销售部 sales@semight.com

地址

苏州高新区湘江路 1508 号 1 号楼

关于联讯

联讯仪器位于苏州高新区湘江路 1508 号，是国内高端测试仪器和设备提供商。联讯仪器主要专注于高速通信测试，光芯片测试和半导体测试三大领域，可以提供包括高速误码仪、网络测试仪、宽带采样示波器、高精度波长计、光谱仪，通用数字源表等高端测试仪器，以及高速光电混合 ATE，激光器芯片老化机，激光器芯片测试机，硅光晶圆测试机，功率芯片测试机，晶圆老化机等高端测试设备。

联讯仪器坚持以客户为中心，以员工为根本，以创新为驱动，尽精微致广大的企业文化，心怀不断填补国内高端测试仪器设备空白的使命，为达成国内领先、国际知名的高端测试仪器设备提供商的愿景而不懈奋斗。

更多信息请访问 www.semight.com

*本文中的产品指标和说明可不经通知而更新